

「信頼性評価を、
より正確に、より確実に」
J-RAS 計測ソリューション

プリント基板、電子材料、半導体パッケージ基板、高電圧対応デバイスなどの絶縁信頼性・導通信頼性評価に最適な製品ラインナップを取り揃えています。

完全自社設計の計測回路を搭載した各製品が、評価の高精度化と信頼性向上に貢献し、お客様の企業価値向上を支えます。

総合カタログ

J-RAS 株式会社

2026

■ ■ 絶縁信頼性評価システム

新材料の登場や加工技術の進歩に伴い、絶縁信頼性評価試験の重要性はますます高まっています。J-RAS では、高速同時サンプリング処理、ハイサイド計測方式、最大 10kV 対応の高電圧多チャンネル装置など、充実した製品ラインナップにより、さまざまな試験対象や評価ニーズに対応します。

【ECM-100】 エレクトロケミカルマイグレーションテスター



マイグレーションテスターのスタンダードモデル。
1V~300V までのワイド印加電圧、全 CH 同時サンプリング処理で 16msec の高速データ収録を実現した高性能テスター。

印加電圧： 1~300V
計測速度： 16msec/100CH(全 CH 同時サンプリング処理)
計測方式： ハイサイド計測
最大 CH 数： 100CH/台

【ECMr-500】 エレクトロケミカルマイグレーションテスター



印加電圧を最大 500V まで拡張した 2026 年度発売の新製品。
2007 年度発売以来好評の ECM-100 の機能と性能を引き継ぎ、より高電圧となり様々な試験に対応。

印加電圧： 1~500V
計測速度： 16msec/100CH(全 CH 同時サンプリング処理)
計測方式： ハイサイド計測
最大 CH 数： 100CH/台

【ECMr-1000/2000】 エレクトロケミカルマイグレーションテスター



最大 2000V の高電圧でマイグレーション試験、絶縁信頼性評価が可能。高電圧ながら全 CH 同時サンプリング & ハイサイド計測方式により単一 GND のサンプル基板にも対応。

印加電圧： 5~1000V、5~2000V
計測速度： 16msec/100CH(全 CH 同時サンプリング処理)
計測方式： ハイサイド計測
最大 CH 数： 100CH/台

【HVUa-1000/2000/3000/4000/6000/10000】 高電圧絶縁信頼性評価装置



最大 10000V で各種高電圧デバイスの信頼性評価や寿命試験に活躍。今まで難しかった高電圧 & 多チャンネルの試験が安全 & 確実、便利 & 手軽で誰にでも実行可能。

印加電圧： 50V~1kV/2kV/3kV、100V~4kV/6kV、250V~10kV
計測速度： 約 50msec/1CH(スキャン処理)
計測方式： ローサイド計測
最大 CH 数： 50CH/台(1000V~6000V)、25CH/台(10000V)

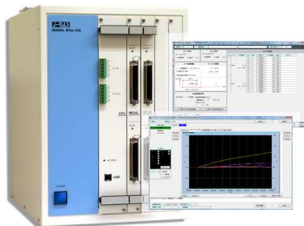
<オプション>

通信機能 ・チャンパー ・HAST	試験自動化に対応するソフトウェアオプションです。 環境試験装置の温湿度上昇制御を行い、目標環境到達時にテスターを自動スタートします。 温湿度データを抵抗値データに付加しデータ管理の効率化を実現します。
抵抗ボックス ・1M/10M/100M/1G	ケーブル接続コネクタに接続しテスターの抵抗値計測精度をチェックできます。 始業前点検に最適です。
校正ユニット ・校正用電流出力	nA レベルの微小電流校正に対応した校正機器です。 各テスターの電流計測レンジを高精度に校正することができます。

■ ■ 導通信頼性評価システム

近年の高密度設計や 3D 実装技術の進展により、微細パターンが複雑に形成された配線構造が増えています。J-RAS のテスターは高い安定性と高精度な計測データにより、BGA、ビア等の接続部の信頼性評価を力強くサポート。

【RTm-100】 導通信頼性評価装置



mΩレベルの微小抵抗から 200kΩまでの抵抗計測が可能な多チャンネル導通テスター。小型筐体に AC/DC 電流源を標準搭載し用途に合わせて利用可能。半導体リレー方式で高精度、高信頼性を実現。

印加電流： 25 μA～25mA (AC/DC)
計測速度： 約 50msec/1CH (スキャン処理)
計測方式： 4 端子計測方式
最大 CH 数： 240CH/台

【RTm-30DC】 導通信頼性評価装置 (電流ストレス印加型)

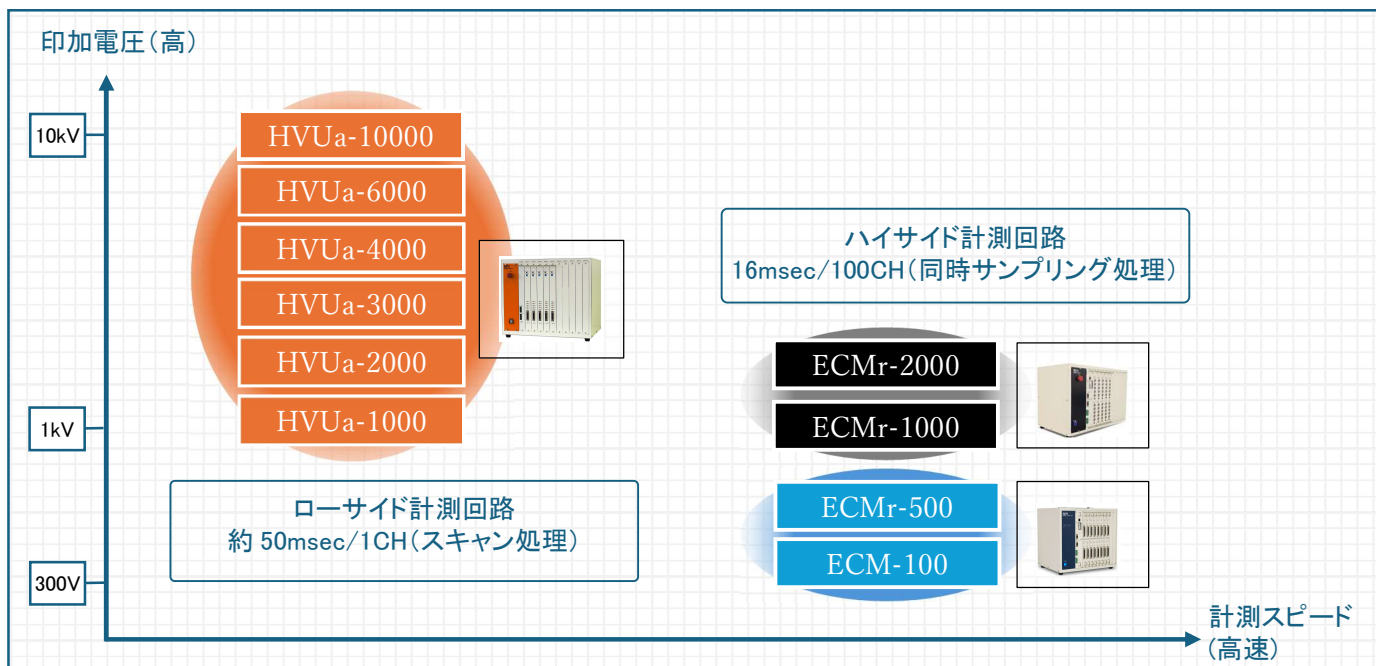


スルーホールなどの局所接続部に最大 3A の電流ストレスを印加して接続信頼性評価を行うテスター。計測分解能 5 μΩ 以下の計測回路は微小な抵抗変化率も高感度に検出。

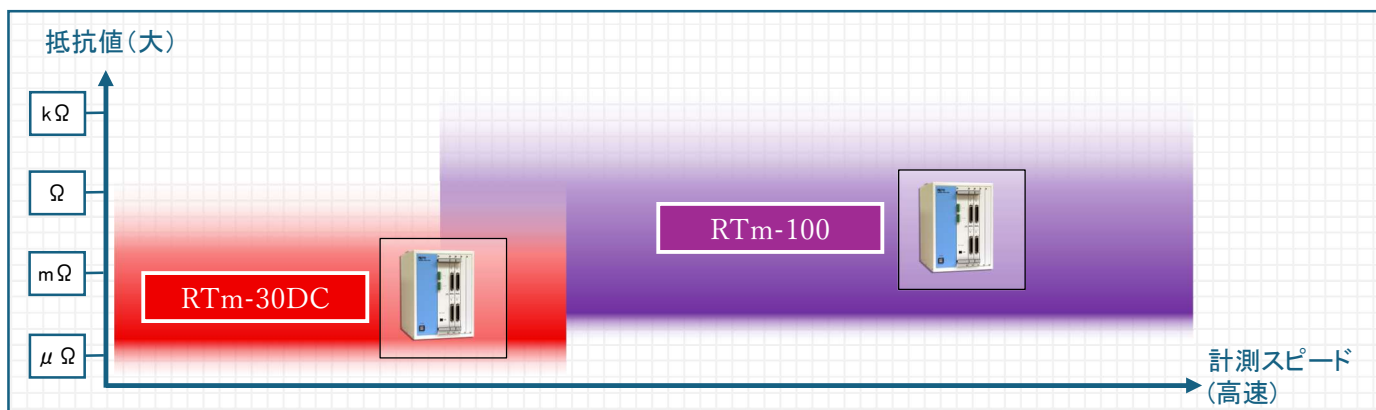
印加電流： 0.1A～3.0A (DC)
計測速度： 約 1sec/1CH (スキャン処理)
計測方式： 4 端子計測方式
最大 CH 数： 160CH/台

■ ■ 機種選定チャート

○ 絶縁信頼性評価システム (計測方式、計測スピード、出力電圧)



○ 導通信頼性評価システム (計測スピード、抵抗測定範囲)





J-RAS 株式会社

〒191-0062

東京都日野市多摩平1-2-6

TEL 042-513-4630 FAX 042-513-4631

URL <https://j-ras.com>

Mail info@j-ras.com

お問合せは

A dashed-line rectangular box intended for contact information or a message.